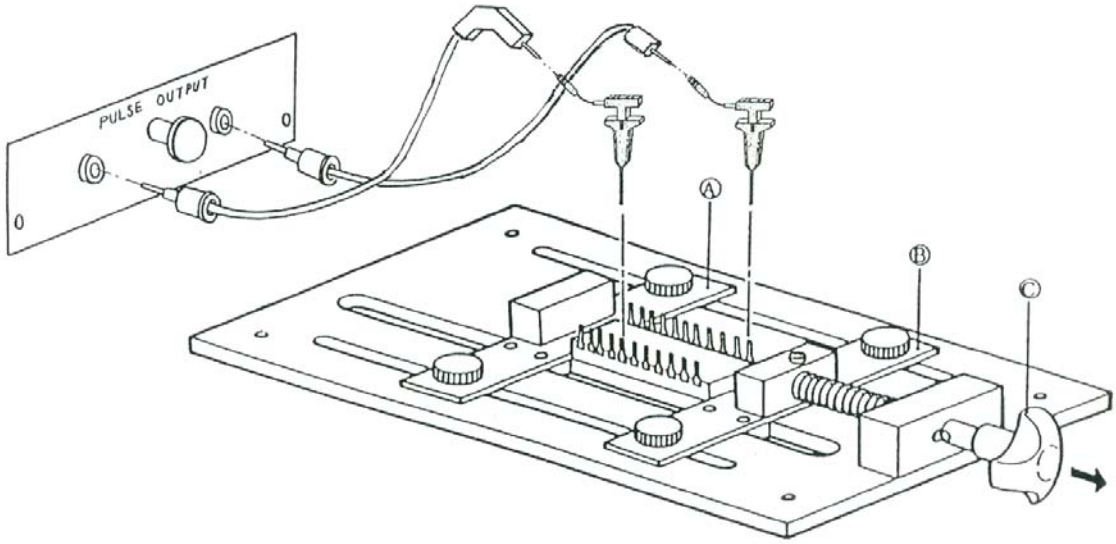
NoiseKen®

取扱説明書

MODEL 18-00001A

株式会社 ノイズ研究所

第 2.01 版
AEM00006-001-1B

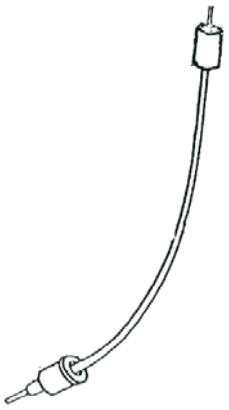


1. この IC 試験ボードは、半導体を逆さまにして挟むタイプです。
2. IC 試験ボードをテストボード収納部に置いて使用します。
3. Ⓐの押さえ板のローレットビスを、半導体の大きさに合わせて適当な位置にスライドさせ、ローレットビスで固定します。
4. Ⓒのツマミを回転させると、Ⓑの押さえ板が半導体を押さえます。
   （注：この時、Ⓑの押さえ板のローレットビスはゆるめておいてください。）
5. CR ユニットの OUT 端子・G 端子と、IC 試験ボード上の半導体の足とを、IC クリップを付けたテストリードにて接続します。
6. 半導体を取り外す時は、Ⓒのツマミを矢印の方向に引いて、90 ° 回転させると半導体を取り外すことができます。

※IC ピンを IC クリップで挟む時、隣のピンに触れないように離して挟んでください。
※印加中は、IC クリップ、テストリードに触れないようにしてください。感電することがあります。

添付品

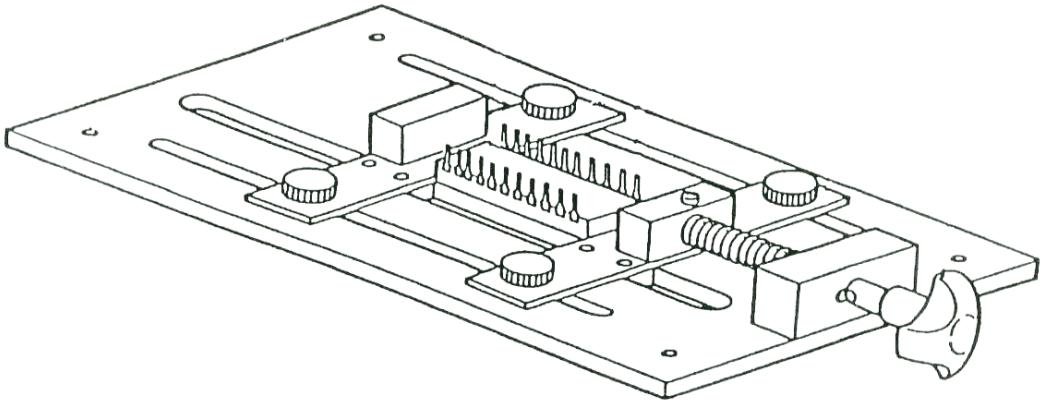
フリーボード ……1 個
テストリード ……1 本
IC クリップ（赤）……1 個
IC クリップ（黒）……1 個



テストリード

IC クリップ（赤）

IC クリップ（黒）



フリーボード